## 电路综合设计实验



林华杰、唐成凯 电子实验教学中心 西北工业大学



### 实验课要求与课程安排:

- □不允许缺课、迟到!
- □禁止更换实验位!
- □禁止更换仪器设备!
- □禁止抄袭!

周数	实验内容	考核内容
9	电子设计与电子实验 放大器非线性失真研究(25分)	
10		预习报告1 (15分) 实验一验收 (10分)
11	基于PT100的温度测量(25分)	预习报告2 (15分)
12		实验二验收(10分)
13	程控直流稳压电源(25分)	预习报告3 (15分)
14		实验三验收(10分)
15	火焰检测电路(25分)	预习报告4 (15分)
16		实验四验收(10分)

□ 实验考核:设计报告+实物验收

- □ FTP://10.70.179.33
- □ 登录名: dlzhsj
- □ 密码: dlzhsj
- □实验报告只允许上传pdf文件
- □报告命名: 2(实验)\_15(组号)姓名1学号1姓名2学号2.pdf

#### 仪器的使用

#### □双通道跟踪示波器

- □时基
- ■触发
- □探头

□ 用信号源DG4202产生调

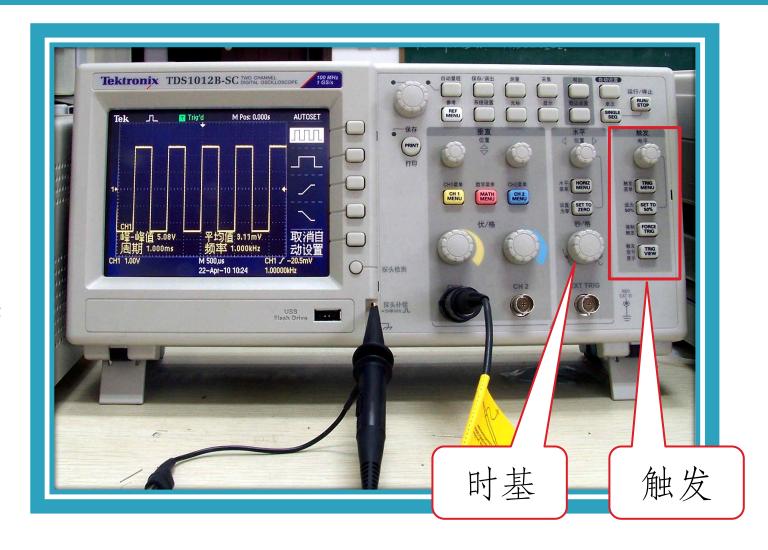
幅波: 载波频率: 30MHz;

幅度: 500mVp-p; 调制

频率: 1kHz; 调制深度:

50%。

用示波器观察波形,测量幅值。



## 仪器的使用

- □双路直流稳压电源
  - □工作电流
  - □限流调节
  - □过流指示灯
  - □串并联
  - □接地柱
- □电路工作前必须限流
- □ 问题:输出+12V/-12V



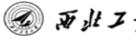
## 仪器的使用

□万用表

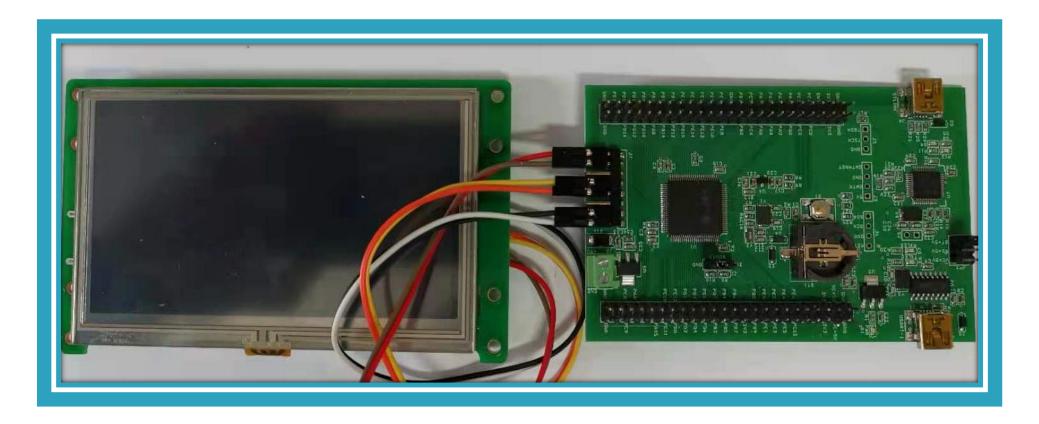
□AC: 50Hz, 正弦波

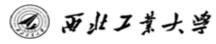
□ STM32F407开发板



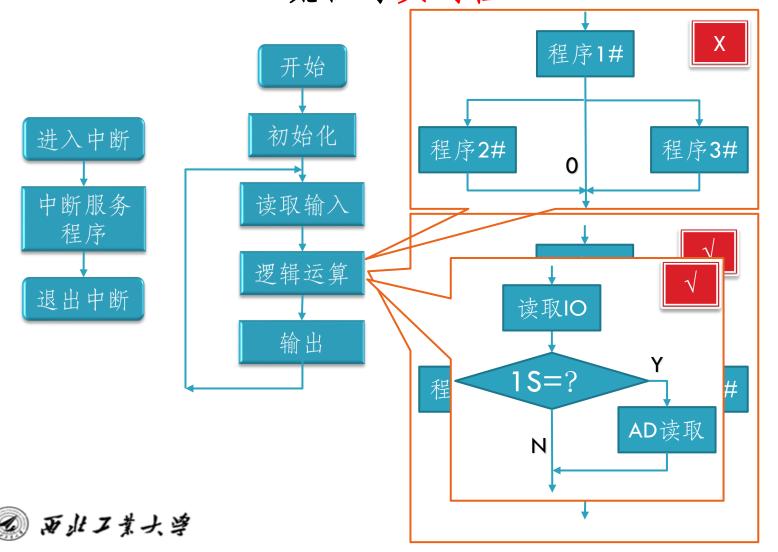


#### □ STM32F407开发板+串口屏(实验2、3、4)





#### □ Stm32F407流程与实时性

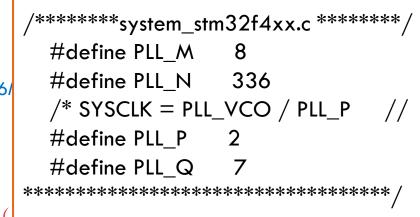


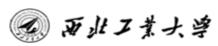
```
x_cpu_init(void);
void
void
             x_get_input(void);
void
             x_logic_scan(void);
             x set output(void);
void
int main(void)
   x_cpu_init();
                                    Stm32f4xx_it.c
   while (1){
             x_get_input();
             x_logic_scan();
             x_set_output();
void x_cpu_init(void){
              • • • • •
void x_get_input(void){
void x_logic_scan(){
              • • • • • •
void x_set_output(void){
              . . . . . .
```

#### □ Stm32F407的SAR ADC特性

- ▶ 采样率:
- PLL\_VCO = (HSE\_VALUE or HSI\_VALUE / PLL\_M) \* PLL\_NPLL\_VCO=8/8\*336=336/
- SYSCLK = PLL\_VCO / PLL\_P=336/2=168M(系统时钟不能超过168M)
- HCLK = SYSCLK / 1 (AHB1Periph) 则HCLK=168M
- PCLK1 = HCLK / 4 (APB1Periph)则 PCLK1 =168/4(函数中定义分频值)
- PCLK2 = HCLK / 2 (APB2Periph) 则PCLK2=168/2=84M(函数中定义分频值)
- ADC\_CommonlnitStructure.ADC\_Prescaler = ADC\_Prescaler\_Div4;
- ADC\_RegularChannelConfig(ADC1, ADC\_Channel\_1, 1, ADC\_SampleTime\_3Cycles);
- 采样率: 84M/4/ (3+12) =1.4MHz

·Hz						
Table 65.	ADC characteristics <sup>(1)</sup>					
Symbol	Parameter	Conditions	Min	Тур	Max	Unit
V <sub>DDA</sub>	Power supply		1.8 <sup>(2)</sup>	-	3.6	V
V <sub>REF+</sub>	Positive reference voltage		1.8 <sup>(2)(3)(4)</sup>	-	V <sub>DDA</sub>	V
f	ADC clock frequency	$V_{DDA} = 1.8^{(2)(4)}$ to 2.4 V	0.6	15	18	MHz
†ADC	ADC clock frequency	$V_{DDA} = 2.4 \text{ to } 3.6 \text{ V}^{(4)}$	0.6	30	36	MHz



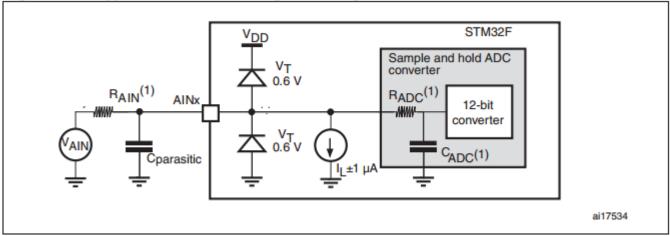


#### □ Stm32F407 的SAR ADC特性

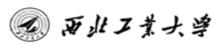
- 采样率: 1.4MHz (SYSCLK=168MHz)2.4MHz (SYSCLK=144MHz)
- ➤ 采样值V<sub>AIN</sub><V<sub>REF+</sub>, V<sub>REF+</sub> = 2.5V
- → 分辨率: 12、10、8、6
- ▶ 输入特性:
- ightarrow 建立时间:  $t_c = (R_{ADC} + R_{AIN}) \times C_{ADC}$
- ADC\_RegularChannelConfig(ADC1, ADC\_Channel\_1, 1, ADC\_SampleTime\_3Cycles);
- ▶ 3/f<sub>ADC</sub>> t<sub>c</sub>(不满足,则测量值小于实际值)
- ► R<sub>AIN</sub>最大值计算公式:

$$R_{AIN} = \frac{(k-0.5)}{f_{ADC} \times C_{ADC} \times \ln(2^{N+2})} - R_{ADC}$$

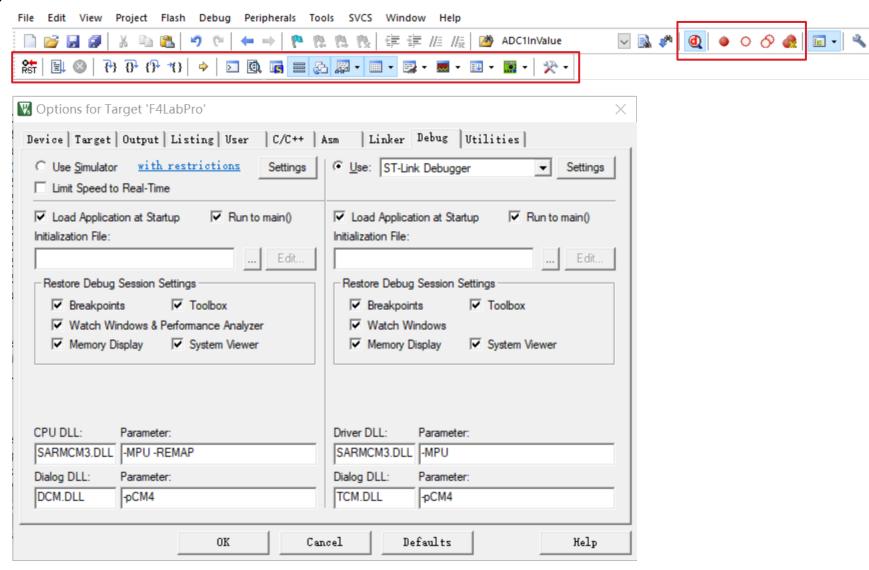
Figure 48. Typical connection diagram using the ADC

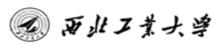


5);	V <sub>AIN</sub>	Conversion voltage range <sup>(6)</sup>		0 (V <sub>SSA</sub> or V <sub>REF</sub> - tied to ground)	•	V <sub>REF+</sub>	٧
	R <sub>AIN</sub> <sup>(5)</sup>	External input impedance	See Equation 1 for details	-	•	50	kΩ
	R <sub>ADC</sub> <sup>(5)(7)</sup>	Sampling switch resistance		-	•	6	kΩ
	C <sub>ADC</sub> <sup>(5)</sup>	Internal sample and hold capacitor		-	4	•	pF

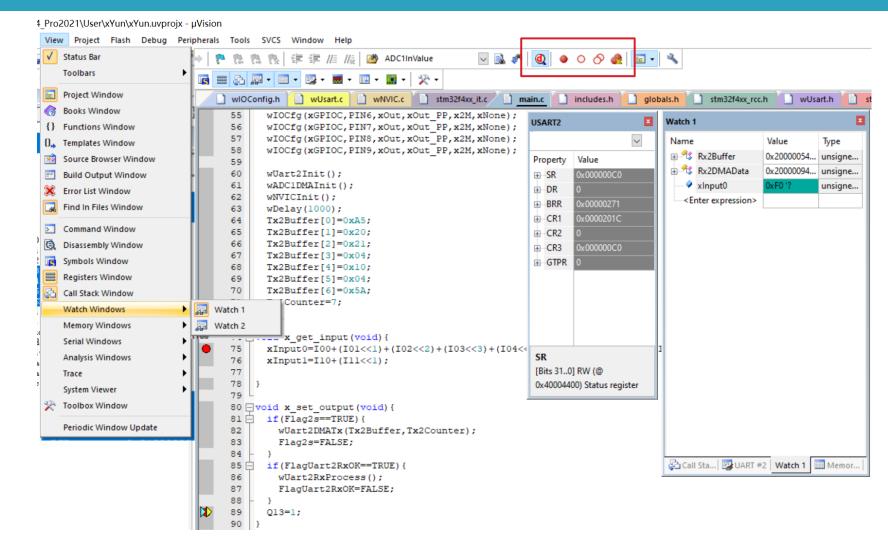


□ 调试— "Debug"

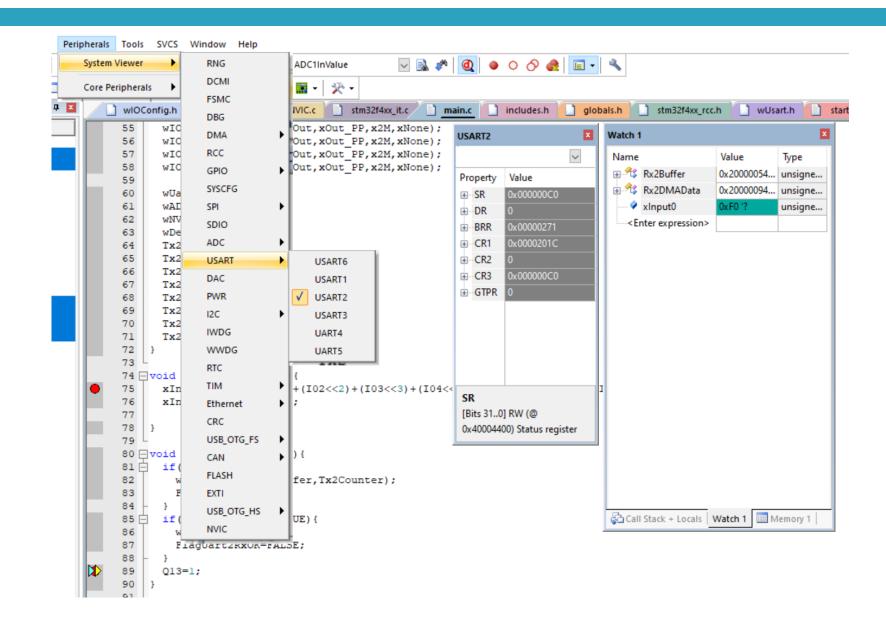


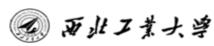


□ 调试— "Debug"



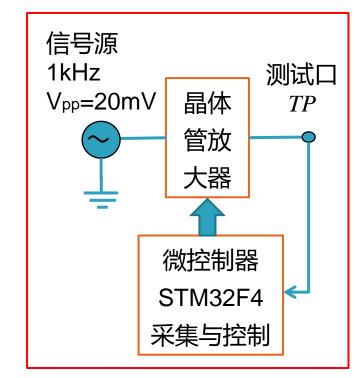
□ 调试— "Debug"



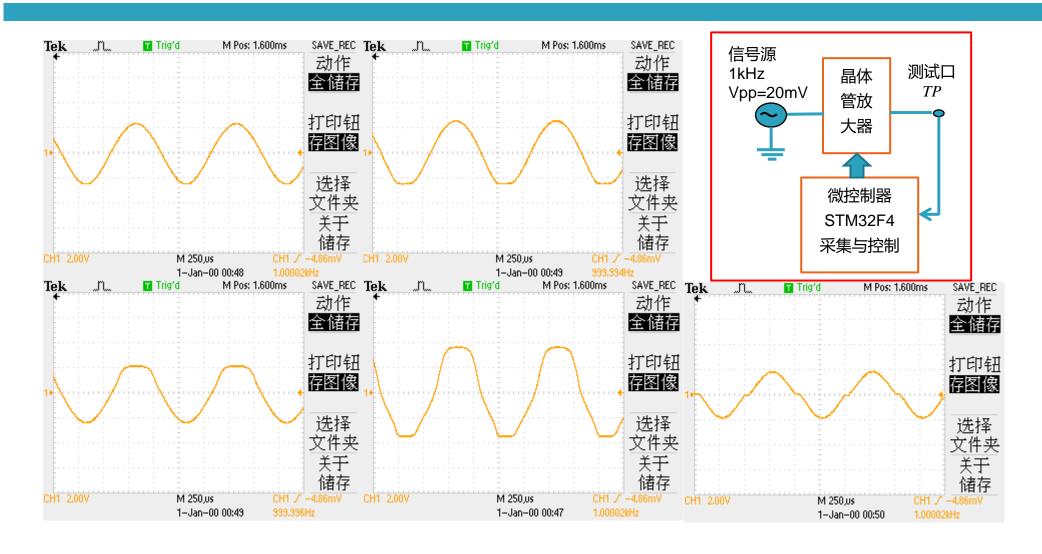


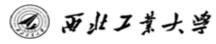
任务:设计并制作一个放大器非线性失真研究装置。信号源输出频率 1kHz、峰峰值 20mV 的正弦波作为晶体管放大器输入电压ui,测试口TP输出无明显失真波形及四种失真波形uo,且峰峰值不低于 2V。

- □ 放大器能够输出无明显失真的正弦电压uo1。
- □ 放大器能够输出有"顶部失真"的波形uo2。
- □ 放大器能够输出有"底部失真"的波形uo3。
- □ 放大器能够输出有"双向失真"的波形uo4。
- □ 放大器能够输出有"交越失真"的波形uo5 (无需程控)。
- □ 长按按键SW1,输出波形在"自动"和"手动"模式切换。
- □ "自动"模式下,间隔5S依次循环输出uo1 (uo5)、uo2、uo3、uo4。
- "手动"模式下,短按按键SW1依次循环输出uo1(uo5)、uo2、uo3、uo4,短按键SW2依次循环输出uo4、uo3、uo2、uo1(uo5)。



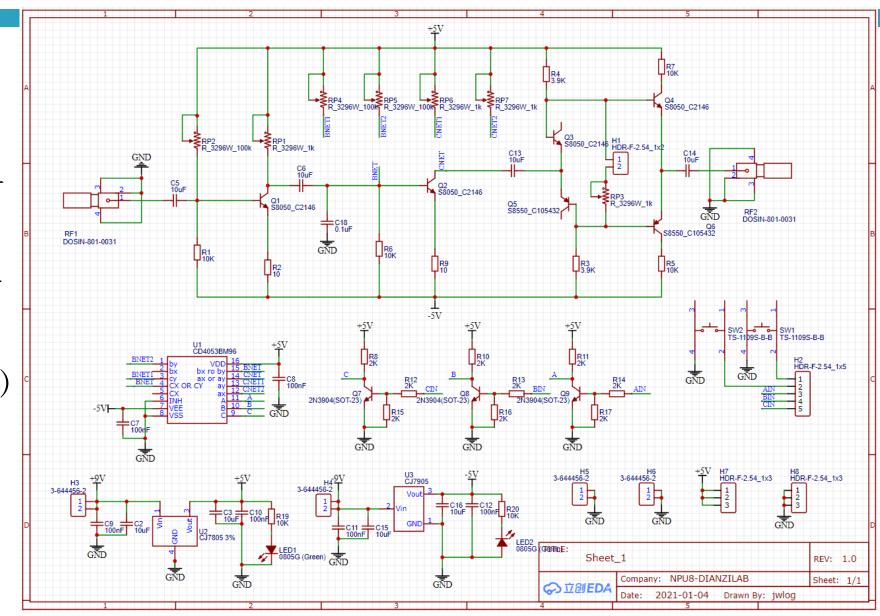


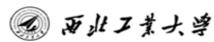




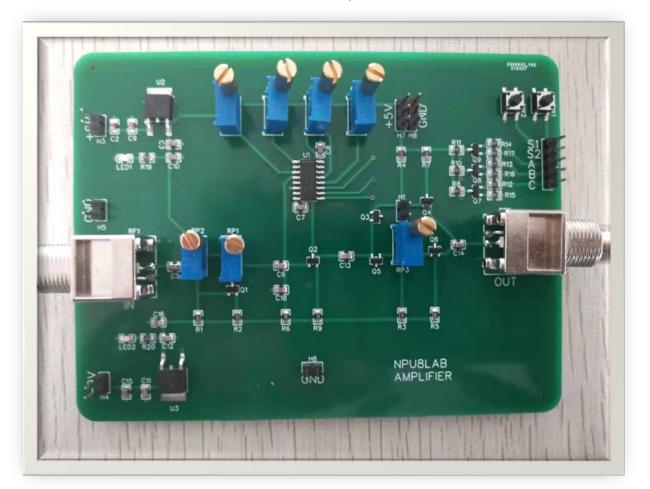
#### 预习内容:

- □ 详细阅读S8050、 S8550、CD4053、 LM7805、LM7905手 册,熟悉原理图
- □ 利用Multisim仿真放 大器电路(利用 2N3904、2N3906 替代S8050、S8550)
  - > 确定电位器值
- □设计合理调试流程。
- □设计单片机流程图。





□ 正确使用实验电子仪器, 合理调试电路。

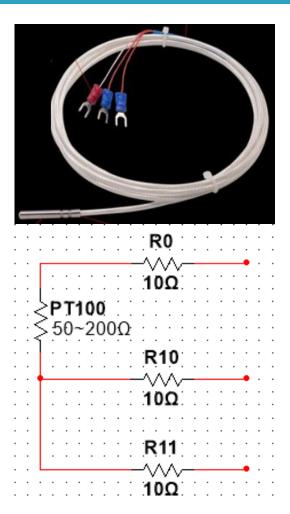


离 实 验室 位

## 实验二、基于PT100的温度测量

# 任务: 在工业控制中经常采用PT100测量温度。实现基于PT100的温度测量。

- □阐述三线制恒压分压式电阻测量方法和消除线阻原理。并利用Multisim给出PT100测量的前端电路(AD采样前),通过仿真验证电路设计的合理性。(温度测量范围-100°C~+200°C)。
- 利用STM32F407和MAX31865测量温度(-100°C~+200°C) 并通过串口屏显示当前温度。
- ■通过串口屏可显示当前时间和温度、可设置报警温度。当前温度大于报警温度屏幕显示报警。具有历史记录,记录报警时间。以及其它显示和设置功能。
- □利用三极管\$8050,3V有源蜂鸣器设计声音报警电路,当前温度大于报警温度声音报警持续5s。

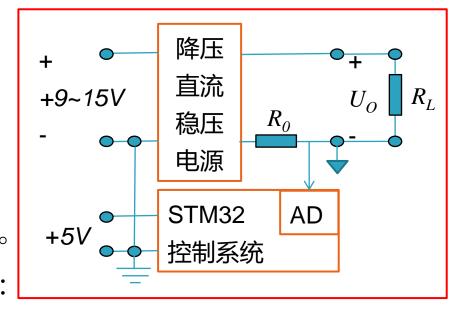




## 实验三、精密直流稳压电源

# 任务:以降压芯片XL1509-ADJ为核心器件,设计并制作一个降压型精密直流开关稳压电源。

- □ 额定输入直流电压为DC+9~15V时,额定输出直流电压为+5±0.05V(测试负载RL=100Ω、3Ω)。 并测试输出电源纹波。
- □ 每格1s通过单片机串口发送电源输出电流(输出电流的通信协议可自定义)。
- □可通过串口屏关闭、打开电源,并显示输出电流。
- □可通过串口屏控制电源输出电压,输出电压范围: DC+2~7.5V,步进: 0.1V,测试负载RL=100Ω。



#### 实验四、火焰检测电路

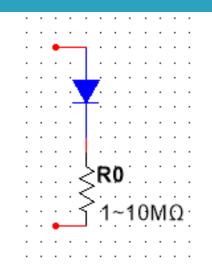
任务:离子火焰检测传感器可检测是否起火。离子火焰检测传感器具有单向导电性,其电路模型如图所示。设计火焰检测电路。系统供电DC±9V。

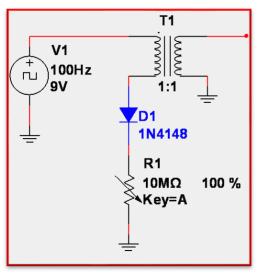


□ 利用Multisim设计并仿真火焰检测前端电路(AD采样前),验证电路设计的合理性。

利用LM324/OP07、变压器(1:1)、若干电阻、电容、二极管(1N4148)、三极管实现火焰检测前端电路。

- · 理想变压器
- > UU9.8-50mH
- □ 利用STM32F407进行采集,并通过串口屏显示火焰的大小,显示图中RO (1~10MΩ) 的阻值。

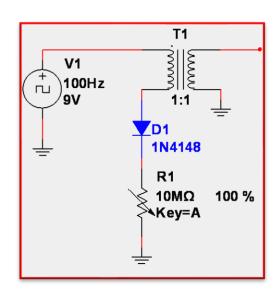






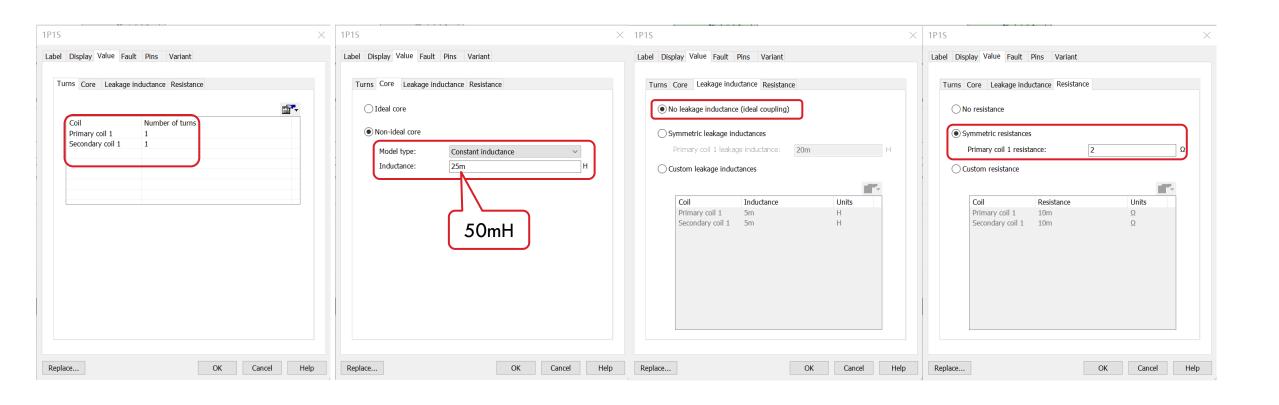
## 实验四、火焰检测电路

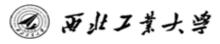
- ■利用Multisim设计
- ▶ 运放的选择: LM324/OP07
- 》 变压器
  - ✔ 利用理想变压器进行仿真
  - ✓ 利用UU9.8-50mH模型进行仿真
    - ◆ 与理想变压器的区别,如何改进电路
- □合理调试
  - ▶ 仿真与实测的区别?

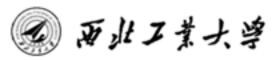


## 实验四、火焰检测电路

#### > UU9.8-50mH







## **END**

电子实验教学中心

